

# テストのビッグデータ活用による半導体業界の検査技術の進化

中村 芳行 \*

Evolution of Testing Techniques of Semiconductor Industry by Utilization of Big Test Data

Yoshiyuki NAKAMURA\*

---

\* ルネサスセミコンダクタ パッケージ&テストソリューションズ株式会社技術統括部テスト技術部 (〒187-8588 東京都小平市上水本町 5-20-1)

\*Test Technology Development Dept. Renesas Semiconductor Package & Test Solutions Co.,Ltd (5-20-1, Jousuihon-cho, Kodaira-shi, Tokyo 187-8588)